Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Техническое задание

Разработка и изготовление лабораторного макета миниатюрного спектрометра энергичных частиц (СМЭЧ)

Оглавление

1	Введение	3
2	Тактико-технические требования	3
2.1	Состав изделия	3
2.2	Требуемые характеристики	4
2.3	Сцинтилляционные шайбы (СШ) и SiPM	4
2.4	Монтажно-защитный корпус (МЗК) и температурный датчик (ТД)	5
2.5	Блок электроники (БЭ)	5
2.6	Режимы работы	6
2.7	Программное обеспечение (ПО)	7
2.8	Комплект документации	7
3	Порядок ведения разработки	8

1 Введение

Лабораторный макет миниатюрного спектрометра энергичных частиц (далее макет), изготавливаемый в рамках выполнения работ по гранту РНФ № 17-72-20134, предназначен для демонстрации достижимых измерительных характеристик предлагаемой детектирующей схемы в лабораторных условиях.

2 Тактико-технические требования

2.1 Состав изделия

2.1.1 Макет состоит из двух блоков: 1) блока детектирования (БД) и 2) блока электроники (БЭ). БД состоит из набора расположенных вдоль общей оси сцинтилляционных шайб (СШ), присоединенных к ним кремниевых лавинных фотодиодов (SiPM), температурного датчика (ТД), монтажно-защитного корпуса (МЖК). Схема устройства БД макета представлена на рис. 1.

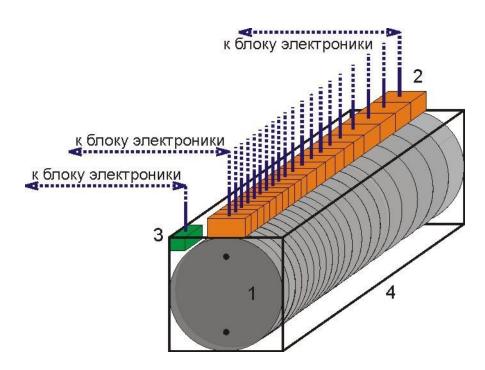


Рис. 1 Основные элементы детекторного блока макета: 1 – сцинтилляционные шайбы, 2 – кремниевые лавинные фотодиоды (SiPM), 3 – температурный датчик, 4 – монтажно-защитный корпус.

2.2 Требуемые характеристики

- 2.2.1 Макет БД разрабатывается исходя из принципа минимизации массогабаритных характеристик, которые должны обеспечивать возможность установки макета на платформу стандарта "CubeSat". Габариты (длина-ширина-высота) макета БД не должны превышать: 8 см х 6 см х 6 см. Масса макета БД не должна превышать: 700 г.
- 2.2.2 Диапазон энергий регистрируемых частиц: электроны от 1 до 10 МэВ, протоны от 10 до 100 МэВ.
- 2.2.3 Энергетическое разрешение (dE/E) для обоих сортов частиц в рабочем диапазоне энергий не хуже 10%.
- 2.2.4 Концепция макета БД должна обладать модификационной гибкостью. В частности, она должна позволять увеличивать верхнюю границу энергии регистрируемых частиц путем добавления новых детектирующих элементов (СШ, просматриваемых SiPM), а также улучшать энергетическое разрешение посредством изменения толщины СШ.
- 2.2.5 Макет должен обеспечивать требуемые измерения при одновременных радиационных загрузках потоками электронов с энергией выше 1 МэВ до 10^6 см⁻² с⁻¹ и протонов с энергией выше 10 МэВ до 10^6 см⁻² с⁻¹; и при отношении потоков электронов и протонов обозначенных энергий до 10^6 .
- 2.2.6 Составные элементы макета БД должны быть съемными и заменяемыми.
- 2.2.7 Макет должен быть работоспособным в лабораторных условиях.
- 2.2.8 Концепция макета БД должна обеспечивать измерения энергичных частиц при окружающем давлении, характерном для околоземного космического пространства от ~ 100 нПа (в ионосфере на высоте около 400-500 км) до ~ 1 нПа (в солнечном ветре на 1 А.Е.) и ниже.
- 2.2.9 Макет БД должен штатно функционировать при рабочих температурах от -30 °C до +60 °C.

2.3 Сцинтилляционные шайбы (СШ) и SiPM

- 2.3.1 Общее количество СШ не должно превышать 32 штук.
- 2.3.2 СШ имеют форму цилиндров одного диаметра не более 4 см. Толщины СШ могут меняться в диапазоне от 1 до 10 мм.

- 2.3.3 СШ располагаются друг за другом вдоль общей оси, проходящей через их центр, без зазора или с минимально возможным зазором не более 3 мм. Толщина зазора согласуется дополнительно.
- 2.3.4 В СШ могут быть проделаны сквозные отверстия для обеспечения их соосности и фиксации.
- 2.3.5 На СШ могут быть сделаны технологические скосы и/или вырезы для их крепления к корпусу, а также для крепления к ним SiPM. Возможно соединение SiPM с СШ посредством оптоволокна. Типы и способы крепления согласуются дополнительно.
- 2.3.6 Светосбор с каждой СШ должен осуществляться не более чем тремя SiPM. Общее количество SiPM не должно превышать 32 штуки.
- 2.3.7 СШ должны быть покрыты/обернуты светоотражающим материалом (за исключением мест крепления к ним оптоволокна/SiPM). Тип и материал покрытия согласуются дополнительно.
- 2.3.8 Тип сцинтиллятора и SiPM согласуются дополнительно.

2.4 Монтажно-защитный корпус (МЗК) и температурный датчик (ТД)

- 2.4.1 МЗК предназначен для монтажа и фиксации СШ, а также для пассивной защиты СШ и SiPM от проникающего излучения.
- 2.4.2 В МЗК могут иметься окна, соосные СШ, для обеспечения беспрепятственного входа частиц и входы/выходы для каналов питания SiPM и ТД и их связи с БЭ.
- 2.4.3 Материал и характеристики МЗК согласуется дополнительно.
- 2.4.4 ТД предназначены для диагностики температуры в области СШ и SiPM, с целью чего ТД крепятся к внутренним поверхностям МЗК максимально близко к СШ. Тип и количество ТД согласуются дополнительно.

2.5 Блок электроники (БЭ)

- 2.5.1 БЭ состоит из источника(ов) питания, усилителей SiPM, АЦП, каКС. Состав БЭ согласуется дополнительно.
- 2.5.2 БЭ должен обеспечивать питание всех входящих в состав БД SiPM и ТД, снятие с них сигналов, их оцифровку и передачу в ПЭВМ.

- 2.5.3 Для связи БЭ с SiPM и ТД БД используется КС. КС обеспечивает SiPM и ТД питанием, подаваемым с БЭ, и передачу с SiPM и ТД сигналов в БЭ. В КС БД должен также входить жгут для связи с ПЭВМ. Характеристики КС согласуются дополнительно.
- 2.5.4 Требования к массогабаритным характеристикам БЭ не предъявляются.
- 2.5.5 БЭ должен удовлетворять требованиям п.п. 2.2.7 2.2.9.

2.6 Режимы работы

- 2.6.1 Макет может функционировать в двух различных режимах: 1) в режиме поштучного счета частиц одночастичный режим и 2) в интегральном режиме (подлежит дополнительной проработке в рамках проекта).
- 2.6.2 В одночастичном режиме, при потоке частиц, приходящих на входную СШ, не превышающем критическое значение F_c , определяются значения энергии каждой приходящей частицы, выделяемой в различных СШ. Информация записывается в память и обрабатывается с помощью программ на ПЭВМ. Исходя из измеренных значений выделенной энергии в различных СШ, определяются диапазоны возможных параметров частицы, а также отсекаются частицы, пришедшие под большими углами. В полученных диапазонах параметров определяется набор параметров, максимизирующий значение функции правдоподобия произведения вероятностей наблюдать измеренное энерговыделение при данном наборе параметров. Таким образом определяется тип и энергия каждой детектируемой частицы.
- 2.6.3 При превышении критического потока частиц Е одночастичный режим работы сменяется интегральным режимом. (Удалил!) интегральном режиме определяются суммарные энерговыделения частиц в фиксированный интервал времени Δt . Информация СШ записывается в память и обрабатывается с помощью программ на ПЭВМ. Для анализа спектра в интегральном режиме используется методика регуляризации, позволяющая без потери точности строить решение обратной интегральной задачи – определение дифференциальных энергетических спектров электронов и протонов из интегрального спектра выделенной всеми частицами энергии в различных СШ. В качестве референтных кривых восстановления могут поглощения ДЛЯ использоваться как данные

компьютерного моделирования, так и экспериментально полученные калибровочные данные.

- 2.6.4 Максимальный объем целевой информации в единицу времени, обеспечивающей требуемые характеристики измерений, не должен превышать ~100 байт/с*. Значение согласуется дополнительно.
- * Максимальный объем целевой информации в единицу времени, обеспечивающей требуемые характеристики измерений, определяется исходя из ограничений (для малых КА типа "CubeSat") на объем телеметрии $Imax\sim 1$ -10 МБ/сутки (1 МБ = 10^6 байт), время интегрирования сигнала Δt (в диапазоне от 10 до 300 с), количество СШ и SiPM.

2.7 Программное обеспечение (ПО)

- 2.7.1 ПО должно позволять с помощью ПЭВМ выполнять обработку экспериментальных данных, полученных с помощью макета в различных режимах работы, для демонстрации достижимых измерительных характеристик макета.
- 2.7.2 ПО должно обеспечивать сохранение и визуализацию результатов эксперимента и их обработки (в частности, темпы счета детекторов, определенные дифференциальные энергетические спектры частиц и пр.) в различных форматах. Требования к ПО уточняются дополнительно.

2.8 Комплект документации

- 2.8.1 В комплект документации макета входят:
 - Комплект КД;
 - Документация на СШ, SiPM, усилители, АЦП, кабели/разъемы и другие закупаемые/изготавливаемые компоненты;
 - Краткое описание реализованной функциональной схемы макета;
 - Краткое описание режимов работы макета;
 - Описание ПО
 - Компьютерная 3D модель (Geant4) БД макета и ее краткое описание
 - Отчет о выполнении лабораторного тестирования макета на пучках энергичных частиц

3 Порядок ведения разработки

- 3.1.1 Работы по разработке макета финансируются из средств гранта РНФ № 17-72-20134.
- 3.1.2 Требования к разрабатываемому макету могут изменяться по согласованию.
- 3.1.3 Все отступления от требований настоящего документа должны согласовываться с его разработчиком.
- 3.1.4 Примерный график работ по разработке макета представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Вид работы	Ответственный	Сроки	Примечание
	исполнитель		
1. Разработка прототипа макета	МФТИ, ИЯИ	02.2018	
		02.2019	
2. Проработка элементной базы для создания макета (выбор типа и геометрических характеристик СШ, SiPM, усилителей, АЦП, ТД, КС, МЗК, разъемов и пр.)	ИЯИ, МФТИ (согласуется с ИКИ)	09.2018 06.2019	
3. Проработка технических решений для создания макета (выбор типа отражающего покрытия СШ, способа фиксации СШ и светосбора с них посредством SiPM, расположение и фиксация SiPM и пр.)	ИЯИ, МФТИ (согласуется с ИКИ)	09.2018 06.2019	
4. Сборка и лабораторные испытания прототипа макета (для проверки элементной базы и технических решений)	ияи	12.2018 06.2019	
5. Определение перечня необходимых покупных изделий и материалов для изготовления макета	ияи, ики	06.2019 08.2019	
6. Выпуск комплекта КД для прототипа макета в соответствии с ЕСКД (без нормоконтроля);	ИКИ	02.2019 04.2019	
7. Закупка изделий и материалов для изготовления макета	ИКИ	06.2019 08.2019	
8. Сборка макета	ИЯИ	08.2019 10.2019	
9. Разработка методологии для обработки экспериментальных данных и графика лабораторных испытаний	МФТИ, ИЯИ	08.2019 10.2019	
10. Лабораторные испытания макета	ИRИ	11.2019 01.2019	
11. Подготовка отчетных материалов	ИЯИ, МФТИ	02.2020 04.2020	